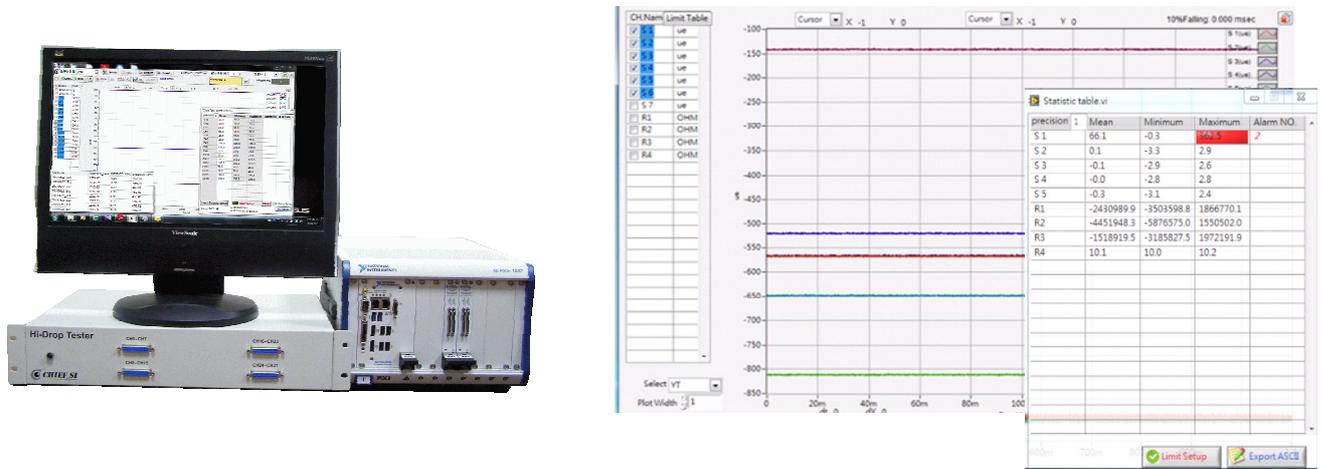


Hi-Drop Tester II

For JEDEC Standard



落下測試資料記錄系統可加速測試效率：

Hi-Drop 為巨克富科技研發出的一套針對 PCB 落下測試的專用高速多通道電阻量測系統，並符合 JEDEC 規範。Hi-Drop 量測速度最高可達每通道 1 MS/s，解析度可達 16-bit 並具備抗雜訊功能，可確保量測資料的準確性。系統可與落下測試機同步量測，各通道 NG 條件可獨立設定，並具備 Event 記錄功能，測試波型資料可自動儲存。

系統特色：

- 提供高速電阻量測，最高可達每通道 1 MS/s。
- 採用 PXI 高規格的量測主機，最多可支援 64-channel。
- 自動 NG 判定，符合 JEDEC 準則。
- 高精度且抗雜訊能力強大。
- 可與現有落下測試機整合，達到自動測試功能。
- 可結合加速規模組，執行高於 10000 g 落下之電阻與加速度量測。
- 可結合應變模組，同時量測電阻與應變資料。
- 及時分析 Peak 加速度、速度、Duration。
- 可做多次 Drop 之趨勢分析。
- 資料即時顯示、收錄、分析、各式報表產出於一身，有效提高工作效率。

Specification

系統架構	PXI Express
機箱插槽數	8
通道數	4N (N ≤ 16), Max. 64 channels
連續取樣速度	Max. 50kS/ch (@16 ch)
觸發取樣速度	Max. 1 MS/Ch
電阻量測解析度	16 bit
電阻量測檔位	20Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100 kΩ, 1MΩ, 10MΩ ^{*註 1}
電阻波型紀錄	支援
長時間連續錄	支援
量測方式	連續擷取 或 外部觸發擷取
NG 判斷條件	每通道獨立設定
各通道 Fail 準則	彈性設定(X 次 Drop 有 Y 次 NG)
與落下試驗機同步觸發	支援
濾波功能	Low pass, High pass, Band pass
	各通道濾波頻率獨立設定
統計運算	支援
虛擬通道	支援
圖表格式	Y-T Graph, X-Y Graph, Bar Chart, Trend
Event 歷程紀錄	支援
報表輸出格式	EXCEL, ASCII
外部觸發模組	高速光電感測器/磁感測器
高 g 值加速度模組(Optional)	支援 IEPE 或 Charge 或 Bridge Type 加速規
	分析 Peak 加速度、速度、Duration
	多次 Drop 之趨勢分析
自動回饋調整落下高度(Optional)	支援
支援語言	英文
螢幕機本需求	1280×768 resolution
支援作業系統	Windows XP, WIN7, WIN8

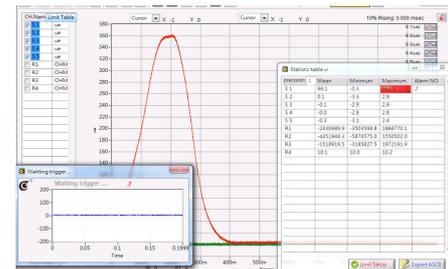
*註 1: 測試電壓可提升至 10V 時，量測範圍可達 10 MΩ

選配項目：

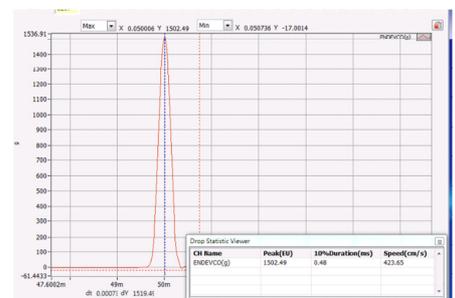
高 g 值加速規：10000 g、20000 g

加速度量測模組：1M S/s 速度、1 通道 (會佔用 1-ch 電阻量測通道)

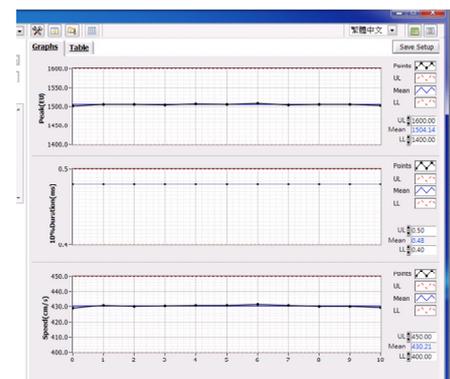
應變量測測模組：100 kS/s/Ch 速度、8 通道



NG 即時判斷
Fail 準則判斷



加速度、速度、Duration 分析



Drop 之趨勢分析